

Referências bibliográficas

ABNT. *NBR ISO 9000:2000*. Sistema de gestão da qualidade: requisitos. Rio de dezembro, 2000.

ALGARTE, W.; QUINTANILHA, D. *A história da qualidade e o Programa Brasileiro da Qualidade e produtividade*. Rio de Janeiro: nov., 2000.

CAMARANO, D. M.; et al. *Programa de Trabalho Educacional em Metrologia*. Anais apresentados no II Congresso Brasileiro de Metrologia, Metrologia-2000. São Paulo/SP: dez., 2000.

CARVALHO, E. A. *Comunicação pessoal com o professor Eduardo Atem de Carvalho*. Centro de Ciência e Tecnologia da Universidade do Estadual do Norte Fluminense (UENF). Rio de Janeiro: jul. / ago., 2002.

CASTELLS, M. A. *A Era da Informação: economia, sociedade e cultura*. A Sociedade em Rede. São Paulo: Paz e Terra. v. I, ed. 6, 2002.

CNI. *Avaliação da Conformidade: conhecendo e aplicando na sua empresa*. "Projeto Sensibilização e Capacitação da Indústria em Normalização, Metrologia e Avaliação da Conformidade". Brasília/DF: CNI, 2000a.

CNI. *Normalização, Metrologia e Avaliação da Conformidade em 17 setores brasileiros: estudos de casos*. "Projeto Sensibilização e Capacitação da Indústria em Normalização, Metrologia e Avaliação da Conformidade". Brasília/DF: CNI, 2000b.

CNI. *Normas Técnicas: conhecendo e aplicando na sua empresa*. "Projeto Sensibilização e Capacitação da Indústria em Normalização, Metrologia e Avaliação da Conformidade". Brasília/DF: CNI, 2000c.

CNI; SENAI; INMETRO. *Barreiras Técnicas às Exportações: o que são e como superá-las*. Disponível em www.inmetro.gov.br, acesso em 01 out. 2002a.

CNI; SENAI; INMETRO. *Vocabulário de metrologia legal*. A que se refere a portaria INMETRO n. 102, de 10 de junho de 1998. 2ª Ed. Brasília, DF: SENAI/DN, 2000b.

CNI; SENAI; INMETRO. *Vocabulário internacional de termos fundamentais e gerais de metrologia*. 2ª Ed. Brasília/DF: SENAI/DN, 2000c.

CONMETRO. *Plano Nacional de Metrologia*. Documento Síntese Elaborado para o CONMETRO. Rio de Janeiro: CONMETRO, 1998a. Série Brasileira de Publicações em Metrologia.

CONMETRO. *Resolução nº 5, de 12 de outubro de 1988*. Dispões sobre a Aprovação do documento "Regulamentação Técnica - Diretrizes para Elaboração, Revisão e Revogação". Rio de Janeiro: CONMETRO, 1988.

DALLARI, D. *A CIDADANIA E SUA HISTÓRIA*. Rio de Janeiro, out. 2002. Disponível em <http://www.dhnet.org.br/inedex.htm>. (Acesso em 17/09/ 2002).

Decreto de 29/07/1998. Dispõe sobre a celebração do contrato de gestão entre o INMETRO e a União, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), qualificando-o como Agência Executiva do Governo Federal, em conformidade com seu contrato de gestão.

Decreto Legislativo DLG nº 104, de 05/12/1983. Autoriza a adesão do Brasil à convenção que institui uma Organização Internacional de Metrologia Legal, concluída em Paris, a 12 de outubro de 1955, e emendada em 12 de novembro de 1963.

Decreto nº 1.422, de 20/03/1995. Dispõe sobre a composição e o funcionamento do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (CONMETRO).

Decreto nº 2.171, de 05/03/1997. Altera os artigos 1 e 2 do Decreto 1.422, de 20 de março de 1995, que dispõe sobre a composição e o funcionamento do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (CONMETRO).

Decreto nº 2.487, de 02/02/1998. Dispõe sobre a qualificação de autarquias e fundações como Agências Executivas, estabelece critérios e procedimentos para a elaboração, acompanhamento e avaliação dos contratos de gestão e dos planos estratégicos de reestruturação e de desenvolvimento institucional das entidades qualificadas e dá outras providências.

Decreto nº 2.488 de 02/02/1998. Define medidas de organização administrativa específica para as autarquias e funções qualificadas como agência executiva e dá outras providências.

Decreto nº 4.039 de 03/12/2001. Aprova a estrutura regimental e o quadro demonstrativo dos cargos em comissão e das funções gratificadas do INMETRO, e dá outras providências.

Decreto nº 81.621, de 03/05/1978. Aprova o Quadro Geral de Unidades de Medida, em substituição ao apêndice do Decreto 63.233, de 12 de setembro de 1968.

Decreto nº 89.461, de 20/03/1984. Promulga a convenção que institui uma Organização de Metrologia Legal, em 1955.

DIAS, J. L. de Mattos; *Medida normalização e qualidade; aspectos históricos da Metrologia no Brasil*. Rio de Janeiro: INMETRO/Fundação Getúlio Vargas, 1998. Ilustrações, 292.

DPDC. *Informe DPDC*. Brasília: DPDC, ano I, n. 1, dez., 2001.

ERBER, Fábio. S. *Desenvolvimento Tecnológico e Intervenção do Estado: um confronto entre a experiência brasileira e a dos países centrais*. RAP. out./dez., 1980.

FERRARI, Amílcar F. *Pelúcio e a Pós-Graduação no Brasil*. Brasília: Paralelo/CAPES, 2001.

FINEP. *Relatório de Atividades da FINEP*. Rio de Janeiro: FINEP, 1984.

FROTA, M. N. *Considerações sobre o Mestrado em Metrologia para a Qualidade Industrial da PUC-Rio: Diagnóstico, Oportunidades e Perspectivas*. Rio de Janeiro: PUC-RIO, abr., 2001. Documento interno.

FROTA, M. N. *Metrologia: a força oculta do universo*. Informativo da Rede Metrológica do Rio Grande do Sul, 1995.

FROTA, M. N.; DIAS, M. J. L. *Documento de Referência do PNM. Relevância Econômica e Social da Metrologia*. Rio de Janeiro: 1998.

FURTADO, A. T.; FILHO, E. J. C. *Avaliação dos Impactos Econômicos do Programa CBERS: Um Estudo dos Fornecedores do INPE*. Campinas: DPCT/IGE (UNICAMP), mar., 2001.

FURTADO, A. T.; PEREIRA, N. M.; SUSLICK, S.; FREITAS A. G.; POLLI, M. F. *Avaliação de grandes programas tecnológicos: o PROCAP 1000, (Fase II: estudo abrangente do programa)*. Campinas: DPCT/IGE (UNICAMP), dez., 1998.

GIORGETTI, M. F. *Histórico e Perspectivas para as Habilitações do Curso de Engenharia*. Revista da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior, ESTUDOS, ano 16, n. 22, abr., 1998.

GUIMARÃES, E. A.; JUNIOR, J. T. A.; ERBER, F. *A política científica e tecnológica*. Rio de Janeiro: JZE, 1985.

HOJO, O.; et al. *Proposta de uma Forma de Inserção da Disciplina "Metrologia em Química" nos Cursos de Graduação em Química através de um Curso de Extensão Intensivo*. Anais apresentados no II Congresso Brasileiro de Metrologia, Metrologia-2000. São Paulo/SP: dez., 2000.

HORTAL, J. *A Universidade: realidade e esperança*. Rio de Janeiro: PUC-Rio, 2002.

IDEC. *Guia de Municipalização da Defesa do Consumidor no Brasil: Criação de PROCONs Municipais*. Brasília: IDEC, 2001.

INMETRO. *Catálogo de Regulamentos Técnicos do INMETRO e do CONMETRO*. 2ª ed., Rio de Janeiro: 2001.

INMETRO. *Relatório de Atividades 2000/2001*. Rio de Janeiro: INMETRO, 2001b.

INMETRO. *Relatório de Atividades 2001/2002*. Rio de Janeiro: INMETRO, 2002a.

INMETRO. *Relatório de Atividades, Programa de Análise de Produtos – 1º Trimestre de 2002*. Rio de Janeiro: INMETRO, abr., 2002b.

INMETRO; *Pesquisa - Demanda de Recursos Humanos em Laboratórios de Calibração e de Ensaios*. Rio de Janeiro: QualityMark, 1998.

INMETRO-CAPES-CNPq. *Documento Básico*. Programa Nacional para a Formação e Capacitação de Recursos Humanos em Metrologia (Programa RH-Metrologia). Rio de Janeiro: Stamp, jan., 1999a. 91 p.

INMETRO-CAPES-CNPq. *Resultados e Avaliação da Fase 1*. Programa Nacional para a Formação e Capacitação de Recursos Humanos em Metrologia (Programa RH-Metrologia). Rio de Janeiro: jan., 1999b. 109 p.

JAGUARIBE, A. M. *A política científica e tecnológica e sua articulação com a política econômica: elementos para uma análise da ação do Estado*. Campinas: NPCT/UNICAMP, mar., 1987.

Lei Ordinária nº 5.966, de 11/12/1973. Institui o Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (SINMETRO), cria o CONMETRO e o INMETRO e dá outras providências.

Lei Ordinária nº 9.606, de 16/02/1998. Dispõe sobre a criação e extinção de cargos no Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO) e no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

Lei Ordinária nº 9.649, de 27/05/1998. Dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios, e dá outras providências.

Lei Ordinária nº 9.933, de 20/12/1999. Dispõe sobre as competências do CONMETRO e do INMETRO, institui a taxa de serviços metrológicos, e dá outras providências.

LIRA, I. *Evaluating the measurement uncertainty – fundamentals and practical guidance*. Chile: IOP, 2002. 243 p.

MARINHO, V. L. *O Comércio Eletrônico de Informações como Estratégia de Desenvolvimento do Mercado de Serviços Metrológicos*. Rio de Janeiro: mar., 2002. Dissertação de Mestrado - Programa de Pós-graduação em Engenharia de Produção (UFF).

MARTINS, P.L. *Código de Proteção e Defesa do Consumidor: Lei .078/90*. 2ª ed. Rio de Janeiro: DP&A., 2000.

MCT. *Ciência e Tecnologia no Governo Federal 1996*. Brasília: MCT, 1997. p. 93.

MCT. *O Papel do Governo no Fomento Tecnológico*. Rio de Janeiro: MCT, 1994. Prefácio do livro Acesso à Informação: Estratégia para a Competitividade dos autores FROTA & FROTA.

MESQUITA, R. L. C. *O Comércio Eletrônico de Informações como Estratégia de Desenvolvimento do Mercado de Serviços Metrológicos*. Rio de Janeiro: março, 2002. Dissertação de Mestrado - Programa de Pós-graduação em Metrologia para a Qualidade Industrial (PósMCI/PUC-Rio).

MORAES, R. A. *Estado, Educação e Informática no Brasil: das Origens a 1989*. O Processo Decisório da Política no Setor. Artigo disponível no site www.edutecnet.com.br da Rede de Educação e Tecnologia (EDUTEC). Acesso em 28 de agosto de 2002.

NIST. *International Benchmark Study, A Report on Benchmarking the facilities of National Metrology Institutes – Japan, Germany, Brazil, US*. Department of Commerce. Technology Administration, National Institute of Standards and Technology (NIST). Dec., 1998. Internal non-published document.

NORO, J. J. *Nobel, o Homem e o Prêmio*. Rio de Janeiro: JSN, 1999. 111p.

OHAYON, P.; FROTA, M.N; ALENCAR FILHO, J. T. A. de. *Desenvolvimento de RH em metrologia: vulnerabilidades e perspectivas*. Publicação no XXI Simpósio de gestão da Inovação Tecnológica, USP, 30 de setembro de 2000.

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. *II PBCT Plano Básico de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – 1975/79*. Brasília: 1976.

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. *III Plano Nacional de Desenvolvimento – 1980/85*. Brasília: mar. de 1981.

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. *PBCT Plano Básico de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – 1973/74*. Brasília: jun., 1973.7

QUINN, T.J. *Base Units of the Système International d'Unités, their Accuracy, Dissemination and Traceability*. pp. 515-527, V.31, number 6. Special Issue on Physical Units, International Journal of Pure and Applied Metrology ("Metrologia"). Publication of the Bureau International des Poids et Mesures (BIPM). Feb., 1995.

SENADO FEDERAL. *Jornal do Senado*. Edição de quarta-feira, 05 de junho de 2002.

SENAI-DN. *Relatório SENAI 2001*. Departamento Nacional. Brasília: SENAI-DN, 2002a.

SENAI-DN. *Projeto Metrologia Básica: Conceitos e Aplicações – Uma abordagem sistêmica para a sua inserção nos cursos do SENAI*. Brasília: SENAI-DN, 2002b. Projeto Senai de inserção da metrologia em cursos regulares, documento em discussão.

SMITH, B.; SMITH, D. W. *Common Sense in the Cambridge Companion to Husserl*. United Kingdom: Cambridge University Press, 1999, p. 416.

TASSEY, Gregory. *Lesson learned about the methodology of economic impact studies*. The NIST Experience. Gaithersburg: 1999. Artigo disponível no site www.nist.gov. (Acesso em 12 de julho de 2002).

TOKORO, R.; HOJO, O. *Comunicação por telefone e e-mail com os professores: Ossamu Hojo e Roberto Tokoro*. Respectivamente, dos Institutos de Química da Universidade do Estado de São Paulo (USP) e da Universidade Estadual Paulista (UNESP-Araraquara). Jun./out., 2002.

URRUTIA, J. *Comunicação via e-mail*. Membro da equipe de Administração e Finanças do National Institute of Standards and Technology (NIST), 2002.

VASCONCELOS, F. *Comunicação via e-mail com o professor Flávio Vasconcelos*. Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Rio de Janeiro: jul./ago., 2002.

Sites consultados

www.altavista.com.br, (acesso em 12/06/2002).

www.amazon.com, (acesso em 16/05/2002).

www.bipm.org, (acesso em 22/05/2002).

www.bn.com, (acesso em 16/05/2002).

www.cade.com.br, (acesso em 12/06/2002).

www.capes.gov.br, (acesso em 18/07/2002).

www.certi.org.br, (acesso em 23/04/2002).

www.cnpq.br, (acesso em 26/07/2002).

www.demec.ufmg.br/port/p_grad/CursoEsp/Cemetro/index.htm, (acesso em 22/06/2002).

www.dn.senai.br, (acesso em 02/04/2002).

www.edutecnet.com.br, (acesso em 29/07/2002).

www.fiemg.com.br/rmmg, (acesso em 16/08/2002).

www.fieb.org.br/rbme, (acesso em 18/06/2002).

www.google.com.br, (acesso em 12/06/2002).

www.ibp.org.br, (acesso em 13/04/2002).

www.ibametro.ba.gov.br/, (acesso em 22/05/2002).

www.ibict.br, (acesso em 02/08/2002).

www.ibict.br/teses/equipe.htm, (acesso em 23/07/2002).

www.idec.org.br, (acesso em 03/09/2002).

www.imeko.org, (acesso em 02/08/2002).

www.inmetro.gov.br, (acessos em 20/05/2002 e 23/07/2002).

www.inmetro.gov.br/rnml/ipem/ipem.asp?uf=es, (acesso em 22/05/2002).

www.inmetro.gov.br/rnml/ipem/ipem.asp?uf=pe, (acesso em 22/05/2002).

www.inmetro.gov.br/rnml/ipem/ipem.asp?uf=sc, (acesso em 22/05/2002).

www.inmetro.gov.br/rnml/ipem/ipem.asp?uf=se, (acesso em 22/05/2002).

www.ipem.mg.gov.br/, www.ipem.pr.gov.br/, (acesso em 22/05/2002).

www.ipem.rj.gov.br/, (acesso em 22/05/2002).

www.ipem.sp.gov.br/, (acesso em 22/05/2002).

www.ipt.br, (acesso em 05/09/2002).

www.mct.gov.br, (acesso em 20/07/2002).

www.mdic.gov.br, (acesso em 22/07/2002).

www.mec.gov.br, (acesso em 18/07/2002).

www.metrologia.ctc.puc-rio.br, (acesso em 20/06/2002).

www.metrologia.org.br, (acesso em 23/07/2002).

www.metrologica.com.br, (acesso em 23/07/2002).

www.ncsli.org, (acesso em 12/09/2002).

www.nmead.ufrgs.br/metrologia/reldisciplinas.asp, (26/06/2002).

www.oiml.org, (acesso em 10/09/2002).

www.planalto.gov.br, (acesso em 20/05/2002)

www.portaldoconsumidor.gov.br, (acesso em 23/07/2002).

www.posmci.ufsc.br, (acesso em 20/06/2002).

www.pr.gov.br, (acesso em 05/04/2002).

www.procon.df.gov.br, (acesso em 28/03/2002).

www.procon.goias.gov.br, (acesso em 28/03/2002).

www.procon.rs.gov.br, (acesso em 30/03/2002).

www.procon.sp.gov.br, (acesso em 03/03/2002).

www.redemetrologica.com.br, (acesso em 06/07/2002).

www.remesp.org.br, (acesso em 26/06/2002).

www.ufmg.br, (acesso em 30/07/2002).

www.ufpa.br/est/I_CURSO_DE_POS.htm, (acesso em 24/06/2002).

www.ufpe.br, (acesso em 26/06/2002).

www.ufrgs.br, (acesso em 05/07/2002).

www.ufscar.br, (acesso em 22/06/2002).

www.unesp.br (acesso em 24/06/2002).

www.upe.br, (acesso em 25/06/2002).

www.usp.br, (acesso em 28/06/2002).

Bibliografia complementar

As oito referências a seguir enumeradas tratam-se de dicionários ou *thesaurus* utilizados na pesquisa dos conceitos de cidadania. Os demais títulos bibliográficos (artigos, livros e literatura especializada) subsidiaram a autora no entendimento dos conceitos relacionados à “cidadania”, “metrologia” e suas áreas afins, habilitando-a para formulação da presente dissertação. Sendo também sugeridos como referências ao leitor.

- [1] DENT, N. J. H. *Dicionário Rousseau*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1996. Tradução Álvaro Cabral.
- [2] DORON, R; PAROT F. *Dicionário de psicologia*. São Paulo: Editora Ática, 1998. Tradução original *Dictionnaire de psychologie*, França: 1991. Tradução Odilon S. Leme.
- [3] YOLTON, J W. *Dicionário de Filósofos*. Dicionário Locke. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1996. Tradução Álvaro Cabral.
- [4] MICHAEL, I. *Dicionário de Filósofos*. Dicionário Hegel. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1997. Tradução Álvaro Cabral.
- [5] BATTRO, A. M. *Dicionário Terminológico de Jean Piaget*. São Paulo: Pioneira, 1996. Tradução Lino Macedo.
- [6] DICIONÁRIO de Sociologia. Porto Alegre: Editora Globo, 1981.
- [7] DUCAN, M. *Novo dicionário de Sociologia*. Portugal: Res Editora, [198-].
- [8] PIÉRON, H. *Dicionário de psicologia*. Porto Alegre: Editora Globo, 1978. 2ª ed.
- [9] AHMAD, S. Z. *Metrology Education*. Trabalho apresentado no 2002 Workshop & Symposium. San Diego, California: 4 a 5 de ago., 2002.
- [9] ALMEIDA L. A.; FROTA M.H. A.; FROTA, M.N. A *EXPERIÊNCIA BRASILEIRA NA EDUCAÇÃO EM METROLOGIA*. Revista Metrologia & Instrumentação, ano 2, n. 15, nov., 2002.
- [10] ALMEIDA L. A.; FROTA M.H. A.; FROTA, M.N. *Metrologia: um instrumento para a formação integrada da cidadania*, in: METROSUL III, 30 set a 03 out., 2002, Curitiba.
- [11] ALMEIDA L. A.; FROTA M.H. A.; FROTA, M.N. *THE BRAZILIAN EXPERIENCE IN EDUCATION IN METROLOGY*. Submetido ao XVII IMEKO: World Congress Metrology in the 3rd Millennium. Dubrovnik, Croatia, jun. 22-27, 2003.
- [12] CANCLINI, N. G. *Consumidores e cidadãos: conflitos multiculturais da globalização*. 4a ed., Rio de Janeiro: UFRJ, 2001.
- [13] CHESNAIS, F. *A Mundialização do Capital*. São Paulo: Xamã, 1996.

- [14] FROTA, M. N. *A força oculta do universo*. Informativo da Rede Metrológica do Rio Grande do Sul, 1995.
- [15] FROTA, M. N. *Informação e conhecimento em metrologia*. Revista Instrumentação & Metrologia, ano 1, n 1, p 101-105, jun. 2000a.
- [16] FROTA, M. N. *A socialização e a humanização da metrologia*. Revista Instrumentação & Metrologia, ano 1, n 6, jun., 2001a.
- [17] FROTA, M. N. *Metrologia é Vida*. Revista Pesquisa FAPESP, n 59, p. 8, nov. 2000.
- [18] FROTA, M. N.; DIAS, M. J. L. *A relevância econômica da metrologia*. Revista Instrumentação & Metrologia, ano 1, n 2, p 136-148, set., 2000.
- [19] FROTA, M. N.; DIAS, M. J. L. *A terceira onda da metrologia*. Revista Controle da Qualidade Banas, ano IX, n 91, p 46-53, dez., 1999a.
- [20] FROTA, M. N.; et al. *The role of the Brazilian Society of Metrology*. Trabalho apresentado na Reunião de diretores da NCSL. Canadá: 16-20 jul., 2000.
- [21] FROTA, M. N.; FROTA, M. H. A. *Acesso à informação: estratégia para a competitividade*. Brasília: CNPq/IBICT, 1994.
- [22] FROTA, M. N.; OHAYON, P. *PADRÕES E UNIDADES DE MEDIDAS: Referências Metrológicas da França e do Brasil*. Rio de Janeiro: Qualitymark Editora, 1999.
- [23] INMETRO; Macroplan. *Macrocenários Mundiais, Nacionais e do Mercosul, com Focalização na Metrologia, Normalização e Qualidade Horizonte 2020*. 2ª ed., Rio de Janeiro: 1997.
- [24] MCT. *Ciência e Tecnologia no Governo Federal 1996*. Brasília: MCT, 1997. p. 93.
- [25] MCT. *Documento Básico do Programa Tecnologia Industrial Básica e Serviços Tecnológicos para a Inovação e Competitividade*. Brasília: MCT, 2001. 100 p.
- [26] MCT. *Plano Plurianual de Ciência e Tecnologia do Governo Federal PPA 1996/99*. Brasília: MCT, dez. 1996. p. 93.
- [27] OIML. *Assessment of OIML Activities*. OIML Bulletin, vol. XLIII, n. 3., OIML publication. Jul., 2002.
- [28] OIML. *Guide for CIML Members*. Edition 2000 (E). OIML publication, 2000.
- [29] Pós-Graduação PUC-Rio. *Normas para apresentação de teses e dissertações*; Rio de Janeiro: PUC-Rio, Vice-Reitoria para Assuntos Acadêmicos, 2001. Supervisão: Bergmenn, José Ricardo; organização e redação: Souza, Anlene Gomes de.
- [30] UNICAMP; UFRJ; FDC; FUNCEX. *Estudo da Competitividade da Indústria Brasileira*. Roteiro da Síntese Final. São Paulo: 1993. Documento apresentado no Congresso de Encerramento do Estudo da Competitividade da Indústria Brasileira (ECTB).
- [31] VIEIRA, L. *Os argonautas da cidadania: a sociedade civil na globalização*. Rio de Janeiro: Record, 2001. Capítulo 1: Em torno do conceito de cidadania, p. 33-50; Cap. 13: p. 219-225.

